科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 16 日現在

機関番号: 32665
研究種目:挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012 ~ 2013
課題番号: 24651105
研究課題名(和文)パラメトリックX線の特性を利用したコーンビームDEI法の高度化
研究課題名(英文)Advanced study on the cone-beam DEI method based on parametric X-ray radiation
研究代表者
早川 恭史(HAYAKAWA, Yasushi)
日本大学・理工学部・准教授
研究者番号:4 0 3 0 7 7 9 9
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円、(間接経費) 900,000円

研究成果の概要(和文):日本大学電子線利用研究施設(LEBRA)のパラメトリックX線源(PXR)を用い、コーンビーム拡 大効果とX線位相コントラスト法の一種である回折強調型イメージング(DE1)が両立することを実験的に確かめた。実際 に21%の拡大率を持った位相勾配像が得られた。 またDE1の高度化として、X線が試料物質から受ける小角散乱を利用したイメージングを試み、これに成功した。試料と して発泡スチロールを用い、X線エネルギー25.5keVで実験を行った結果、密度が非常に小さくX線の吸収がほとんど無 い発泡スチロールで比較的強いコントラストが得られ、通常のX線像とは本質的に異なる情報が像が反映されることが わかった。

研究成果の概要(英文):We experimentally studied on diffraction-enhanced imaging (DEI), which is a kind o f X-ray phase-contrast imaging, with a magnification effect based on a cone-like beam from the parametric X-ray (PXR) source at LEBRA, Nihon University. As a result of the experiment, a phase-gradient image was a ctually obtained with a magnification power of 1.21. In order to advance the DEI method employing PXR, we successfully demonstrated novel imaging based on small-angle X-ray scattering (SAXS) due to sample materials. In the imaging experiment, styrene foam was used

for the sample material irradiated with 25.5-keV X-rays. As the result, relatively strong image-contrast w as observed at the styrene-foam region, in which the X-ray attenuation is negligible. Thus, we concluded t hat the SAXS image by this method reflects different information from that of ordinary X-ray images.

研究分野: 複合新領域

科研費の分科・細目:量子ビーム科学

キーワード:量子ビーム測定手法 回折型X線位相コントラスト コーンビーム パラメトリックX線放射 小角散乱 イメージング

1.研究開始当初の背景

(1) シンクロトロン放射光の応用研究として, X線位相コントラストイメージングが精力的 に研究されていた。回折強調イメージング (DEI: diffraction-enhanced imaging)は位相コン トラストを得ることができる代表的な手法 であるが,平面波的なX線が必要であるため, もっぱら指向性の高い放射光を用いて基礎 研究が行われていた。また,位相コントラス トイメージングから派生した,X線が試料物 質から受けた小角散乱から画像のコントラ ストを得る手法が注目されつつあった。

(2) 放射光以外に DEI が可能な X 線源として, 本研究代表者が中心となって開発した,パラ メトリック X 線放射(PXR: parametric X-ray radiation)を放射原理とするものが実績を上げ つつあった。PXR は相対論的な荷電粒子と結 晶物質の相互作用により生じる X 線放射現 象である。日大の PXR 線源は 100MeV 電子 線形加速器を用いたもので,放射光源に比べ コンパクトでありながら,エネルギー可変単 色性に加え,空間コヒーレンスが高い X 線が 得られるという特徴があるが,実際にこれを 用いた DEI 実験に成功し,成果が得られてい た。

2.研究の目的

(1) 日本大学電子線利用研究施設(LEBRA: Laboratory for Electron Beam Research and Application)において開発された PXR 線源は, 電子エネルギー100MeV であるため,大型放 射光源に比べて円錐広がりの大きなコーン ビームとなっている。それにもかかわらず, 平面波性の要求の高い DEI に成功しており, シンクロトロン放射光源と比べて特徴的な 点である。コーンビームの拡大効果と位相コ ントラストの両立が可能かどうかを検証し, DEI の高度化の可能性を探る。

(2) DEI 法は試料物質による X 線の屈折角を 測定することにより位相コントラストを得 る手法であるが,これは小角散乱の検出にも 利用可能と考えられる。この観点から,DEI 法に基づく小角散乱コントラストイメージ ングを試み,画像検出器の画素サイズよりも 小さな空間構造の情報の取得が可能かどう かを検証する。

3.研究の方法

(1) PXR ビームを用いた DEI 測定において, コーンビームとしての広がりを積極的に利 用した拡大イメージングを実施する。PXR の 放射源は電子ビームの照射を受けたシリコ ン単結晶であり,結晶上の電子ビームスポッ トが線源点に相当する。日大 LEBRA の PXR 線源では線源点から 10m 以下の伝搬距離で も比較的広い照射野が得られるが,実質的に 直径 100mm の X 線取出し窓で制限され,ビ ーム全体の円錐広がりは 13.7mrad となって



図 1: PXR を用いた DEI 測定の実験セットアップ。(top view)

いる。図1にDEI実験のセットアップの概略 図を示す。この実験において,PXR線源,輸 送用反射板,DEIアナライザーには全て Si(220)完全結晶を用いた。線源点からDEIア ナライザー結晶までの距離が10.0m,アナラ イザー-検出器(X線CCD)間の距離は0.5m とし測定試料を線源点から8.0mおよび9.7m に設置した2種類の測定を行った。前者は後 者に対し,幾何学的には21%の拡大イメージ が取得できることになる。

円錐広がりの効果を広くカバーするために, アナライザー結晶として 160mm 幅のものを 準備したが,実験的には空気による X 線の減 衰を少なくしたいので PXR エネルギー18keV で実施した。Bragg 角が 10.9°であり,カバー できる円錐角度はおよそ 3mrad であったが, 10µrad 程度の完全結晶の回折幅に比べれば十 分に大きい。この条件でアクリル樹脂製の棒 (直径 3mm)を試料として,DEI 実験を実施し, 円錐広がりによる拡大効果を検証した。

(2) 同じ実験セットアップで,小角散乱イメ ージングの実証実験を行った。使用した結晶 面は Si(220)のままであったが、PXR エネルギ ーは 25.5keV にした。測定試料として図 2 に 示すような軽元素物質を用意した。それぞれ の比重は、アクリル樹脂が 1.17g/cm³、発泡ス チロールが 0.16 g/cm³、ポリスチレンが 0.99g/cm³であった。棒の直径は発泡スチロー ル棒が 6mm で,他の 2 つは 3mm であった。 測定自体は通常の DEI 実験と同様で、アナラ イザー結晶の角度を変えながら、回折される X 線像を取得した。

いずれの実験も,電子加速器の運転条件は 電子エネルギー100MeV,マクロパルス電流



図 2: 小角散乱イメージング測定試 料。左からアクリル樹脂棒,発砲スチ ロール棒,ポリスチレン棒。

130~135mA,マクロパルス幅 4.8µs,パルス 繰り返し 5Hz であった。

4.研究成果

(1) エネルギー18keVのPXRコーンビームを用いた拡大DEI測定の結果として,図3に示すような位相勾配(微分位相)像が得られた。図3(a)が線源-試料間距離が9.3mの結果で,(b)が8.0mの時の結果である。それぞれ,X線CCDを用いて300秒の露光時間(実時間)で取得したDEI像2枚の演算処理で得られた像であり,X線が試料物質を通過したために生じた屈折角のマップとなっている。これらの位相勾配像は,今回のDEI測定が10μrad



図 3:コーンビーム拡大 DEI 実験で得ら れた位相勾配像。ここで,線源-試料間 距離はそれぞれ (a) 9.7m,(b) 8.0m で ある。

領域の X 線の屈折に十分感度があることを 示している。拡大率に関しては,実際に幾何 学条件で決まる 1.21 倍になっていることが 確認された。日大 LEBRA の PXR 線源では X 線ビーム取り出し窓の位置が線源から 7.3m のところであるため, 試料をこれ以上線源に 近づけるのは難しい。また,コニオメータと アナライザー結晶をより後方に移動するの もスペースの問題で容易ではない。今回の 21%という拡大率は装置上の制約で最大に近 いものであるが,十分に有意な拡大効果とい える。DEI は平面波性の要求が強く,シンク ロトロン放射光源の中尺・長尺ビームライン で実施されることが一般的となっているこ とを考えると, DEIにおいて数 10%オーダー の拡大率と 10urad の屈折角検出を両立でき

たことは,世界的にもユニークで新奇な成果 といえる。伝搬型の位相コントラストイメー ジングでは,拡大効果を伴う事例は比較的多 くあるが,DEIで有意な拡大効果を示したの は今回が初のケースと思われる。

(2) コーンビーム効果を利用した拡大 DEI の 実証は達成したが,図3にあるように,拡大 像において試料のエッジ部で明瞭度の低下 が見られた。コーンビームの拡大効果を利用 すれば,試料を線源の1m以内に設置すれば 単純に 10 倍以上の拡大像が得られるはずで あるが,このエッジのボケはこのような応用 を制約する要因になる。そこで,比較検証の ために,拡大 DEI と同じ試料を用いた伝搬型 位相コントラストイメージングを,イメージ ングプレート(IP)を検出器として行った。図4 がその結果で,試料-検出器間距離は(a)が 2cm,(b)が2mである。距離を離すことによ る拡大率は 20%で,拡大 DEI とほぼ同じであ る。検出器の違いはあるものの,20%の拡大 のために伝搬距離を長くとっても試料エッ ジ部の不明瞭化は認められず,むしろ屈折 X 線との干渉によるエッジ強調効果が優位で ある。この結果から,拡大 DEI におけるエッ ジ部の不明瞭化は幾何光学的な像のボケと は異なる要因である可能性が高いことが示 唆される。





図 4: 伝搬型位相コントラストイメージ ングの結果。試料 - 検出器間の距離はそれ ぞれ(a) 2cm、(b) 2m である。

(3) 小角散乱イメージングの実証実験におい て.得られた DEI 像の試料の無い直接 X 線の 領域と発泡スチロールの領域から明度をサ ンプリングし,アナライザー結晶の角度を変 数としてプロットしたのが図5である。これ はそれぞれの領域における, ロッキングカー ブの比較となっている。図から明らかなよう に,発泡スチロール領域のロッキングカーブ は幅が広がり、ピーク項も直接 X 線領域に比 べて有意に低くなっている。しかしながら, ピークの中心位置にはほとんど違いがない。 この結果から,発泡スチロールを透過した X 線は試料物質による小角散乱の影響を強く 受けていると推察できる。散乱角が数 urad 程 度であるため,一般に極小角散乱と呼ばれて いる領域である。



図 5:小角散乱イメージングにおける, 直接 X 線領域と発泡スチロール領域の ロッキングカーブの比較。

小角散乱に起因する画像のコントラスト として,ロッキングカーブの中心角度から 8urad ずれた両側の画像の平均を取り, それ とピークにおける画像との差で定義するこ とにした。ここで, 8µrad は直接 X 線に対す るロッキングカーブの 2σ に相当する値であ る。簡単な定義ではあるが,画素毎のロッキ ングカーブの幅の広がりをピーク高の変化 として定量化したものである。この定義で得 られた小角散乱コントラスト像を,通常の吸 収コントラスト像および位相勾配像を空間 積分することによって得られた位相コント ラスト像と比較したのが図6である。図から わかるように、図2の試料に対し、それぞれ コントラストが大きく異なる画像が得られ た。図 6(a)と(b)の吸収コントラストと位相コ ントラストは試料物質の密度に依存するも のであり,実際にアクリル樹脂,ポリスチレ ン,発泡スチロールと密度の大きな順にコン トラストが強くなっている。位相コントラス トは吸収コントラストよりもはるかに感度 が高く明確に試料の構造を反映しているが, 得られる情報は原理的には吸収コントラス トと同等である。一方,小角散乱コントラス ト像では,発泡スチロールで極めて強いコン トラストが得られた。物質密度を考慮すると このコントラストは X 線の吸収や位相シフ



図 6:(a) 吸収コントラスト像;(b) 位 相コントラスト像;(c) 小角散乱コン トラスト像。試料は図 2 に示されるも ので,PXR エネルギーは 25.5keV であ った。

トとは異なる変化によるもので,小角散乱に 基づくものと考えられる。しかも,吸収が極 めて小さい物質に対しても高い感度がある ことがわかる。簡単な定義ではあるが,試料 の物性的な違いで領域分けするのには十分 である。このコントラストは,タルボ干渉計 を使って得られるビジビリティコントラス トと本質的に同じ情報を有していると考え られる。

ここでもう一つ,アクリル樹脂やポリスチ レン樹脂の棒のエッジの部分でもかなり散 乱の効果が強いことが示唆される。屈折によ るピークシフトの影響が強く出ている可能 性もあるが,エッジ部のみ不連続的に強い効 果であり,小角散乱に類似した現象である可 能性が高い。拡大 DEI で拡大率を大きくする ために伝搬距離を長くとるとエッジの不明 瞭化が生じたが,試料のエッジで生じる散乱 が原因とも考えられる。今回の結果はそれを 示唆するものともいえる。

(4) DEI を用いた小角散乱イメージでは、散乱 角をアナライザー結晶の角度で計測するこ とができる。図5の横軸 θ を散乱による運動 量変化 $q=(4\pi/\lambda)\sin(\theta/2)$ に変換し(λ は X 線の波 長), Guinier プロットに相当するものに変換 したのが図 7 である。このプロットからは, 小角散乱の散乱体となっている微粒子の慣 性半径 Rgに相当するものとして ,1µm という 値が得られた。アナライザー結晶自体の回折 幅を含んでいるため,実際の粒子サイズはこ れより大きいと思われるが,測定に使用した X線CCDの画素サイズ24µmよりも小さいこ とは確実と考えられる。この結果は, DEI に よる小角散乱イメージングによって検出器 の空間分解能より小さな構造に対する定量 的な分析の可能性を示唆するものである。



図 7:直接 X 線の領域と発泡スチロール 領域における Guinier プロットの比較。

(5) 本研究課題を実施した結果, PXR 線源の コーンビーム広がりを利用して, DEI で拡大 像が取得可能であることが実証された。同時 に,試料のエッジ部で散乱の効果が強く,拡 大率を大きくした場合に空間分解能を制約 する要因になりうるという示唆も得た。また, 試料による小角散乱を積極的に利用するこ とにより,イメージ検出器の画素サイズより も小さな空間構造に起因したコントラスト が得られ,構造のサイズに関する定量的な情 報もえられることがわかった。

- 5.主な発表論文等
- 〔雑誌論文〕(計 5件)

Yasushi Hayakawa, Yumiko Takahashi, Takao Kuwada, Toshiro Sakae, Toshinari Tanaka, <u>Keisuke Nakao</u>, Kyoko Nogami, Manabu Inagaki, Ken Hayakawa, Isamu Sato, X-ray imaging using a tunable coherent X-ray source based on parametric X-ray radiation, Journal of Instrumentation Vol. 8, 2013, C08001 1-13, 査読有,

DOI: 10.1088/1748-0221/8/08/C08001

<u>Y. Hayakawa</u>, K. Hayakawa, M. Inagaki, T. Kaneda, <u>K. Nakao</u>, K. Nogami, T. Sakae, T. Sakai, I. Sato, <u>Y. Takahashi</u>, T. Tanaka, Computed Tomography for Light Materials Using Monochromatic X-ray Beam Produced by Parametric X-ray Radiation, Nucl. Instr. and Meth. B 309, 2013, 230-236, 查読有,

DOI: 10.1016/j.nimb.2013.01.025

[学会発表](計 9件)

<u>早川恭史</u>, PXR 円錐ビームを用いた極小 角散乱イメージング,第20回 FEL と High-Power Radiation 研究会(2014 年 3 月13日~3月14日,日本大学理工学部, 東京)

Y. Hayakawa, K. Hayakawa, M. Inagaki, T. Kaneda, K. Nakao, K. Nogami, T. Sakae, T. Sakai, I. Sato, Y. Takahashi, T. Tanaka X-ray Imaging Based on Small-angle X-ray Scattering Using Spatial Coherence of Parametric X-ray Radiation , The X International Symposium "Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures" (RREPS-13) (2013 年 9 月 23 日~9 月 28 日, セバン, アルメニア), 招待講演 Yasushi Hayakawa, Yumiko Takahashi, Takao Kuwada, Toshiro Sakae, Toshinari Tanaka, Keisuke Nakao, Kyoko Nogami, Manabu Inagaki, Ken Hayakawa, Isamu Sato, X-ray imaging using a tunable coherent X-ray source based on parametric X-ray radiation, MASR 2012 (7th International Symposium on Medical Applications of Synchrotron Radiation) (2012年10月17日 ~10月20日,上海,中国),招待講演

6.研究組織

(1)研究代表者
早川 恭史(HAYAKAWA, Yasushi)
日本大学・理工学部・准教授
研究者番号:40307799

(2)研究分担者

高橋 由美子 (TAKAHASHI, Yumiko) 大学共同利用機関法人高エネルギー加速 器研究機構・物質構造科学研究所・研究員 研究者番号: 70339258

中尾 圭佐 (NAKAO, Keisuke)
日本大学・理工学部・助教
研究者番号: 30440035